

汎用型走査型プローブ顕微鏡 (Nanocute)



メーカー	エスアイアイ・ナノテクノロジー株式会社
型式	Nanocute
概要	<p>走査型プローブ顕微鏡 (Scanning Probe Microscope: SPM) は、微小な探針 (プローブ) で試料をなぞって、その形状や性質を観察することができる顕微鏡の総称です。</p> <p>利用例としては原材料等に微細加工を施した際の実態状況の確認、または微細加工製品の不良原因の分析、化合物の状態の分析・評価等に活用できます。</p> <p>Nanocuteは取扱いが容易な自己検知型カンチレバーの利用が可能で、かつ大気圧、常温下で測定するため煩雑な操作なく測定することができます。</p>
仕様	<p>検出方式：光てこ方式 (AFM、DFM、FFM) 自己検知方式 (DFM)</p> <p>走査範囲：X、Y20μm、Z1.5μm (20μmスキャナ) X、Y100μm、Z15μm (100μmスキャナ)</p> <p>試料サイズ：ϕ20mm以下推奨 (上限ϕ40mm) 厚さ 最大10mm (試料台含)</p> <p>測定環境：大気中</p> <p>測定可能項目：表面形状、位相観察、表面粗さ、 粒子解析、摩擦力分布</p>
オプション	カンチレバーは別途購入、または持ち込みも可能
設置場所	地域産学連携研究センター 装置室A
利用料	770円/時間 (税込)
連絡先	<p>予約、利用相談は電話又はメールにてお問い合わせください。</p> <p>044-934-7250 (内線7250)</p> <p>cii●mics.meiji.ac.jp (●の部分を@に置き換えてお送りください)</p>